

CEI 60749-12
(Première édition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –

Partie 12: Vibrations, fréquences variables

IEC 60749-12
(First edition – 2002)

SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 12: Vibration, variable frequency

CORRIGENDUM 1

Page 2

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 3

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

IEC 60749-12:2002/COR1:2003

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/c654a646-a7f6-42bf-bbfc-ad967ee785c2/iec-60749-12-2002-cor1-2003>